



Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen

28. Februar bis 2. März 2010, Best Western Arosa Hotel, Paderborn

Call for Papers

Programmkomitee

J. Alt
Infineon Technologies AG

W. Anheier
Universität Bremen

B. Becker
Universität Freiburg

W. Daehn
Hochschule Magdeburg-Stendal

R. Drechsler
Universität Bremen

S. Eichenberger
NXP Semiconductors B.V.

G. Fey
Universität Bremen

M. Fischer
Verigy Germany GmbH

A.-P. Fonseca-Müller
Robert Bosch GmbH

W. Glauert
Universität Erlangen

M. Gössel
Universität Potsdam

S. Hellebrand
Universität Paderborn

K. Helmreich
Universität Erlangen-Nürnberg

W. Hoppe
Rheinmetall Technical Publications GmbH

U. Mahlstedt
Infineon Technologies AG

I. Polian
Universität Freiburg

S. Rogge
NXP Semiconductors Germany GmbH

S. Sattler
Universität Erlangen-Nürnberg

J. Schlöffel
Mentor Graphics Development (Deutschland) GmbH

H. Schmidt
IBM Deutschland Entwicklung GmbH

V. Schöber
edacentrum e. V.

A. Steininger
Technische Universität Wien

W. Vermeiren
Fraunhofer IIS EAS Dresden

H. T. Vierhaus
BTU Cottbus

R. Wagner
Robert Bosch GmbH

C. Wegener
National Semiconductor Germany AG

H.-J. Wunderlich
Universität Stuttgart

Der Workshop „Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen“ ist das bedeutendste deutschsprachige Forum, um Trends, Ergebnisse und aktuelle Probleme auf dem Gebiet des Tests, der Diagnose und der Zuverlässigkeit digitaler, analoger, Mixed-Signal- und HF-Schaltungen zu diskutieren. Der Austausch von Ideen ist ein wichtiges Anliegen des Workshops. Erwünscht sind Beiträge aus der industriellen Praxis und von Forschungseinrichtungen. Sowohl sehr stark Praxis bezogene Erfahrungsberichte und Ergebnisse als auch theoretische Beiträge sind willkommen.

Beiträge zu folgenden und weiteren Themen werden erbeten

- Defekt- und Fehlermodellierung
- Testerzeugung und Fehlersimulation
- Testgerechter Entwurf
- Selbsttest für Module und Systeme
- Test von HF-Schaltungen
- Signalintegrität
- Systemtest und -zuverlässigkeit
- Diagnose von Ausfallursachen
- Selbstreparatur und Selbstheilung
- Fehlertoleranz und Online-Test
- Robuste und strahlenresistente Systeme
- Test mechatronischer Systeme
- Automatisches Test Equipment und Testmodellierung
- Testkosten

Der Workshop findet im Hotel Best Western Arosa in Paderborn statt, und wird vom Fachgebiet Datentechnik am Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik der Universität Paderborn durchgeführt. Interessenten werden gebeten, ihren Beitrag im Umfang von maximal 6 Seiten über die Workshop-Homepage einzureichen. Der Beitrag sollte den Zweck der Arbeit, den Neuigkeitsgehalt und Aspekte der Anwendung beschreiben. Angenommene Beiträge werden auf Wunsch in die Workshop Handouts aufgenommen.

Um einen freien Austausch von Ideen und Informationen zu erleichtern, sind während des Workshops Video- und Audioaufzeichnungen nicht gestattet. Die Sprache des Workshops ist deutsch, Beiträge oder Vorträge in englischer Sprache sind jedoch willkommen.

Workshop-Homepage

<http://www.tuz10.de>

Einreichung der Beiträge

bis spätestens **6. November 2009**

über die Workshop-Homepage <http://www.tuz10.de>

Veranstalter

GI FA 3.5 / ITG FA 8.2 / GMM FB 8

RSS Kooperationsgemeinschaft Rechnergestützter Schaltungs- und Systementwurf, Universität Paderborn

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Sybille Hellebrand

Fachgebiet Datentechnik, EIM-E, Universität Paderborn, Warburger Str. 100
33098 Paderborn

Tel.: +49-5251-60-3002, Fax: ++49-5251-60-4221,

e-mail: sybille.hellebrand@uni-paderborn.de